論文

令和3年度 軽金属論文賞 受賞論文

試験機揺動による粗大粒アルミニウムにおける 引張変形中の転位密度変化 In-situ XRD 測定*

足立 大樹**, 溝脇 大史***, 平田 雅裕**** 岡井 大祐**. 中西 英貴*****

Measurement of Dislocation Density Change during Tensile Deformation in Coarse-Grained Aluminum by In-Situ XRD Technique with Tester Oscillation*

Hiroki Adachi^{**}, Hiroshi Mizowaki^{***}, Masahiro Hirata^{****} Daisuke Okai^{**} and Hidetaka Nakanishi^{*****}

By conducting In-situ XRD measurement during tensile deformation while oscillating the tensile tester, it was possible to measure the change in dislocation density of a pure aluminum alloy having coarse grains with the grain size of 20 μ m. In the coarse-grained material, the dislocation density during tensile deformation changed through four regions, as in the case of the fine-grained material. Since the dislocation multiplication start stress was very low at 22 MPa, the elastic deformation region was very short. Thereafter, the dislocations multiplied rapidly, but when the stress and dislocation density reached 33 MPa and $1.57 \times 10^{14} \,\mathrm{m}^{-2}$, respectively, the dislocation multiplication rate was greatly reduced. This is considered to be due to the low dislocation density required to progress the deformation by plastic deformation in coarse-grained aluminum.

Keywords: Dislocation density, Grain size, Synchrotron radiation, In-situ XRD

1. 背 景

結晶粒径が数μm以下の微細粒材は、従来工業的に使 用されていた粒径10μm以上の粗大粒径材とは大きく 異なる種々の機械的性質を示すことが報告されてい る。例えば、粒径が数μm以下の純アルミニウム微細粒 材では、粗大粒径材が示すHall-Petch曲線よりも非常に 高い0.2%耐力を示す。これはExtra-Hardening現象¹⁾ と呼ばれている。また、アルミニウム合金は通常、連続 降伏を示すが, 粒径が数 μ m以下の領域では降伏点降下 現象が発現し¹⁾, 粗大粒径材とは逆に, 微細粒材は冷間 加工により0.2%耐力が低下し, 焼鈍により0.2%耐力が 増加する。これはHardening by Annealing and softening by deformation現象と呼ばれている²⁾。

著者らはこれまで粒径50 nmの純ニッケル超微細粒 材や粒径200 nm~数µmの純アルミニウム微細粒材に おいて, SPring-8放射光を用いたIn-situ X線回折 (XRD)測定により引張変形中の転位密度変化を調べて

*	本稿は軽金属,70 (2020) 274-280 に掲載。
	This paper has been published in Journal of The Japan Institute of Light Metals, 70 (2020), 274-280.
**	兵庫県立大学 工学研究科
	Graduate School of Engineering, University of Hyogo
***	キオクシア株式会社
	KIOXIA Corporation
****	兵庫県立大学 工学研究科 大学院生
	Graduate Student, Graduate School of Engineering, University of Hyogo
****	株式会社 UACJ R&D センター 第二開発部
	Development Department II Research & Development Division UACI Corporation

きた^{3)~7)}。その結果, 引張変形中の転位密度変化は変形 メカニズムに応じて四つの領域に分けられることが明 らかになった。領域 I は弾性変形領域であり, 転位密 度はほとんど増加しない。領域 II に入ると転位が急激 に増殖しはじめ, 塑性変形が開始されるが, 転位密度が 十分大きくないため弾性変形も共に生じる領域であ る。塑性変形のみで変形が進行することができる転位 密度ρ πに達すると急に転位の増加が緩やかとなり, 塑 性変形領域である領域 II に入る。領域 IV では破断に伴 う応力除荷により, 転位密度が急激に減少する。つま り, 除荷後の試料において測定された転位密度は変形 中の転位密度よりも低く, 変形中と除荷後の転位組織 は異なっていることが示唆され, 微細粒材の機械的性 質を議論するためには In-situ 測定が重要である。

一方,工業的に使用する構造用アルミニウム合金の ほとんどは粒径が10 μm以上の粗大粒材料であるため, 粗大粒材の変形中における転位密度増殖挙動を明らか にすることは工業的に重要であり,さらに,アルミニウ ム微細粒材の機械的性質の特異性を理解する上でも非 常に重要である。しかしながら,これまで放射光を用 いた粗大粒材におけるIn-situ XRD測定による転位密 度変化は調べられていなかった。

XRD測定により転位密度を導出するためには、 Williamson-Hall法が良く用いられ、この手法では複数 の回折ピークの回折角度と半値幅を測定することが必 要である^{8),9)}。よって, In-situ測定により転位密度の時 間変化を測定するためには, 広い回折角度を同時に, 高 い角度分解能で,かつ,高い時間分解能で測定すること ができる実験系を構築する必要がある。著者らはこれ まで、高輝度放射光を用いることが出来るSPring-8に おいて, DECTRIS製一次元検出器 MYTHENを直列に 6 台連結した 6 連装 MYTHENを検出器として用いる ことにより実現してきた。ただし、この実験系では一 次元検出器は回折図形の一部を切り取り,回折プロフ ァイルを得ることになる。微細粒材のように試料のX 線散乱体積内に結晶粒数が多い場合,回折図形は連続 なデバイリング状になるため、その一部を切り取って も滑らかな回折プロファイルが得られる。しかし、粗 大粒材のようにX線散乱体積内に結晶粒数が少ない場 合,回折図形は不連続なスポット状となるため,その一 部を切り取った場合には滑らかな回折プロファイルが 得られない。放射光はX線管球から発せられるX線と 比べて非常に指向性が強く拡がりが少ないため、X線管 球を用いた時よりも回折条件は厳密となることからそ もそも回折が生じづらく, さらに, 放射光はビーム径を 大きくすることが難しいことから照射体積を増やすこ

Table 1 Chemical composition of the sample (mass%).

Si	Fe	Ti	Cu, Mg, Mn, Cr, Zn	Al
0.05	0.86	0.02	< 0.01	99.04

 Table 2
 Sample name and annealing conditions.

Sample name	Annealing condition
CR	Cold-rolled
CRA523	CR + 448 K, 0.5 h + 523 K, 0.5 h
CRA573	CR + 448 K, 0.5 h + 623 K, 0.5 h
CRA673	CR + 673 K, 0.5 h
CRA723	CR + 723 K, 0.5 h
CRA773	CR + 773 K, 0.5 h
CRA773L	CR + 773 K, 3 h
ARB	CR + ARB 6 cycles
ARB373	ARB + 373 K, 0.5 h
ARB423	ARB + 423 K, 0.5 h
ARB448	ARB + 448 K, 0.5 h
ARB498	ARB373 + 498 K, 0.5 h
ARB523	ARB373 + 523 K, 0.5 h
ARB573	ARB373 + 573 K, 0.5 h
ARB623	ARB373 + 623 K, 0.5 h

とが困難であるため,粗大粒材では回折条件を満たす 結晶粒数が極端に少なくなり,デバイリング状となら ず,スポット状の回折になりやすい傾向にある。

通常のX線回折実験では試験片を揺動することによって実質的な散乱体積を広げ,回折条件を満たす結晶 粒数を増やすが,今回は引張試験中のIn-situ XRD測定 中であるため引張試験機ごと引張試験片を揺動するこ とによって解決を試みた。そして,連続したデバイリ ング状に近い回折が得られる揺動条件を探索し,アル ミニウム合金粗大粒径材においても引張変形中の転位 密度変化測定を実現することを目的とした。

2. 実験方法

Table 1に1200合金供試材の組成を示す。量産設備 において1200合金を鋳造後,550℃で6h均質化処理を 行い,板厚30mmから2mmまで550~200℃で熱間圧 延後,冷間圧延により板厚1mmの板材とした。この 圧延板材から供試材を採取して各種熱処理を施し,結 晶粒径を粗大化させた。熱処理条件をTable 2に示 す。また,圧延板材を,強ひずみ加工法の一つである繰 返し重ね圧延(ARB)法を6サイクル行い,結晶粒を微 細化させた。ARB法は1サイクル圧下率50%の接合圧 延を繰り返すものであり,理論上は無限にひずみを導 入できる巨大ひずみ加工法の一種である¹⁾。このARB 材にTable 2に示す熱処理を施し,結晶粒径を制御し た。なお,以後の試料名称はTable 2による。これらの 試料に対し,日本電子製走査電子顕微鏡JSM-6500Fに



Fig. 1 Dimensions of tensile test pieces.

搭載したTSL社製OIMを用いて電子線後方回折 (EBSD)法により結晶粒径を測定した。放電加工機を 用いて, 圧延方向が引張方向と平行になるように引張 試験片を切り出した。平行部長さ20mm,幅5mm, 厚さ1mmであり, Fig. 1に詳細な引張試験片形状を 示す。

In-situ XRD測定実験では少しでも回折条件を満たす 結晶粒数を増やすため,指向性が強いアンジュレータ 光ではなく, 偏向電磁石光を用いられる BL19B2 にて行 った。用いた入射X線のエネルギーは25 keV, ビーム サイズは縦0.15 mm,幅3 mmである。ゴニオメータ上 に設置した小型引張試験機に厚さ1mmの1200合金試 験片を取り付けた。粗大粒材におけるIn-situ XRD測 定を行うための適切な揺動条件を調べるため, Fig. 2に 示すように透過方向から13°上方に705.32 mm離れた位 置にDECTRIS製二次元検出器PIALTSU-300Kを設置 し, (111), (200) 回折ピークを観察した。試料から検出 器までの距離は、格子定数が既知であるNIST製CeO2 標準試料からの回折位置から求めた。引張軸方向(Z方 向) に揺動する時間は 1 cycle を 10 s と 一 定 と し, 揺動 距離を0,1,2,3,4mmと変化させることによるデバイ リングの変化を測定した。

転位密度を算出するために行うIn-situ XRD測定時 には、Fig. 3に示すように検出器として6連装 MYTHENを用い、透過方向から21°上方,カメラ長 704.66 mmに設置した。カメラ長は、NIST 製CeO₂標準 試料を用いて求めた。ゴニオメータ上に設置した小型 引張試験に取り付けた試験片に初期ひずみ速度は $3.3 \times$ 10^{-4} s⁻¹で引張変形を施しながら、Z方向に揺動速度 1 mm/sで幅 2 mmの揺動を行いつつ時間分解能 2 sで 測定を行った。得られた (111), (200), (220), (311), (222), (331) 面からの回折ピークプロファイルから回 折ピーク角度と半値幅を求め、Williamson-Hall法を用 いて転位密度を算出した^{4),8),9)}。

3. 実験結果および考察

ARB材とCR773L材のEBSD測定結果をそれぞれ



Fig. 2 Schematic diagram of XRD measurements.



Fig. 3 Schematic diagram of In-situ XRD measurements during tensile test with oscillation.

Figs 4,5に示す。RD-ND面におけるND方向の大角粒 界密度を平均結晶粒径*d*と定義すると,*d*=505 nmであ った。焼鈍温度と時間の増加に伴い粒径は連続的に増 加し,ARB623材では*d*=3.54 µmまで粗大化した。焼鈍 により得られた粒径を**Table 3**に示す。以上から,粒径 500 nm~20 µmまでの幅広い粒径を有する1200合金が 得られた。

Fig. 6 (a)に粒径が最も結晶粒が粗大であった CR773L材における, 揺動を行っていない時の二次元検 出器によるXRD測定結果を示す。なお, 露光時間は 5sである。紙面右から左方向が引張方向と並行方向で あり, 内側の回折が (111) 面からの回折, 外側が (200) 面からの回折である。CR773L材のような粗大粒材に おいてはスポット状の回折が観察された。一方, Fig. 6 (b)に示すように結晶粒が最も微細であったARB材で





Fig. 4 TD inverse pole figure map of ND-RD plane obtained by EBSD measurement of ARB specimen.

は揺動を行っていない場合であっても回折はリング状 であった。なお、Fig. 6の中下段と上段に紙面並行方向 に二つの帯状の回折が検出できていない領域が存在す るが、これは検出器の繋ぎ目である。PILATUS-300K は三つの検出器を連結したものであるため二つの帯状 の連結部が存在する。

次にFig.6中A点(方位角60°)からB点(方位角100°) への(111)面回折強度の方位角変化をFig.7に示す。 微細粒を有するARB材では方位角70°から100°付近で はほぼ一定の強度が観察された。なお,方位角90°が引 張方向と並行な方向である。方位角が70°よりも小さく なるにつれて回折強度が減少するが,これはビーム形 状が幅3mm,厚さ0.15mmと扁平であるため方位角 90°から離れるにしたがって強度が低下することや,集 合組織の影響などであると考えられる。

一方, CR773L材では回折がスポット状であったため, 方位角によって強度のばらつきが大きかった。このこ とから, Fig. 3のように方位角90°の位置に一次元検出 器を設置した時, 微細粒材では揺動なしであってもな めらかな回折プロファイルが得られるが, 粗大粒材の 場合は回折強度がほとんど得られない場合があると予 想される。





Fig. 5 TD inverse pole figure map of ND-RD plane obtained by EBSD measurement of CR773L specimen.

 Table 3
 Average grain diameter of annealed samples.

Annealing condition	Sample name	Average grain diameter (μm)
As-ARBed	ARB	0.505
373 K 0.5 h	ARB373	0.566
423 K 0.5 h	ARB423	0.635
448 K 0.5 h	ARB448	0.711
373 K 0.5 h + 498 K 0.5 h	ARB498	0.977
373 K 0.5 h + 523 K 0.5 h	ARB523	1.26
373 K 0.5 h + 573 K 0.5 h	ARB573	3.02
373 K 0.5 h + 623 K 0.5 h	ARB623	3.54
448 K 0.5 h + 523 K 0.5 h	CR523	1.83
448 K 0.5 h + 623 K 0.5 h	CR623	10.1
673 K 0.5 h	CR673	10.1
723 K 0.5 h	CR723	17.5
773 K 0.5 h	CR773	15.6
773 K 3.0 h	CR773L	20.2

CR773L材における揺動幅による回折図形の変化を Fig. 8に示す。露光時間が一定であっても揺動幅の増 加により回折がスポット状からリング状に近づくこと が分かった。また,(111)面回折強度の方位角方向変化 に及ぼす揺動幅の影響をFig.9に示す。CR773L材であ っても揺動幅の増加より回折強度の方位角変化が平滑 化し,Fig.7に示す微細粒を有するARB材の強度分布 に近づいた。結晶粒を一辺の長さが20 µmの立方体形 状と仮定した時,ビーム径が0.15 mm×3 mm, 試験片の 厚さが1 mmであることから, 照射体積内には約5.6× 10⁴個の粒が入る。これを1 mm揺動させると, 照射体 積内に存在する粒の数は約4.3×10⁵個まで増加し, それ



Fig. 6 (111) and (200) diffractions of (a) CR773L and (b)ARB sample measured by two-dimensional detector.

に伴い回折条件を満たす結晶粒数は8倍に増加すると 予想される。揺動幅を2mm,3mm,4mmに増加する と,それぞれおよそ約8.1×10⁵個,約1.18×10⁶個,約 1.56×10⁶個に粒数が増加することから回折条件を満た



Fig. 7 Change in (111) diffraction intensity along the azimuth direction in ARB and CR773L samples.



Fig. 8 Change in Debye rings with change in oscillation width in CR773L. (a) 1 mm, (b) 2 mm, (c) 3 mm, (d) 4 mm.



Fig. 9 Change in (111) diffraction intensity along the azimuth direction in ARB and CR773L samples and its changes due to the oscillation width.

す結晶粒の数も大きく増加し,回折強度が平滑化する と考えられる。2 mm以上の揺動による回折強度変化は 小さかったことから,一次元検出器を用いた引張試験 中の転位密度変化を求めるためのIn-situ XRD測定で は,2 mm幅の揺動を行いながら引張試験を行った。 また,時間分解能2sとするため,揺動速度は1 mm/sと した。

Fig. 10にARB材における引張変形中の公称応力と 転位密度のストロークによる変化を示す。微細粒であ るARB材において,過去の報告と同様,転位密度は変 形の進行に伴い領域 I~IVの四つの領域を経て変化し た。領域 I では転位密度は増加せず,応力はストロー クの増加に伴い直線状に増加したことから弾性変形領 域であると考えられる。応力がσ」を超え,領域Ⅱに入 ると急激に転位密度が増加したことから,転位源が活 性化することにより転位が増殖し、転位すべりによる 塑性変形が開始したと考えられる。しかしながら,領 域Iにおける応力-ストロークの直線関係から応力の 増加がやや緩やかになるものの,応力は大きく増加し ていることから弾性変形も依然として生じており,弾 性変形と塑性変形がともに生じている領域であると言 える。領域 I と領域 II の境界における応力 σ_Iは102 MPaであり,転位増殖が開始する応力であることから 降伏応力とみなすことができる。0.2%耐力は162 MPa であり、σ₁よりも60 MPaも高く、微細粒材では0.2% 耐力を転位増殖開始応力として扱うことは適切ではな いと言える。領域Ⅱにおいて転位密度が大きく増加し, 転位密度 ρ_I=9.1×10¹⁴m⁻²に達すると転位密度の変化 が急に緩やかになり、領域Ⅲに移行した。また、ρ Ⅱに 達した時の応力を σ_{II} とすると、 σ_{II} =190 MPaであり、 0.2%耐力は σ_{I} よりもむしろ σ_{I} に近かった。 ρ_{I} と σ_{I} の意味については後ほど議論する。領域Ⅲにおける転 位密度の変化は非常に緩やかであった。ARB加工によ り作製した粒径260 nmの純Niでは領域Ⅲにおいて緩 やかに転位密度は増加したことから4).この領域におい ても転位増殖は生じているが, NiとAlでは融点が異な ることから動的回復速度は純アルミニウムの方がかな り速く,動的回復と転位増殖がつりあったため,領域Ⅲ では転位密度は増加しなかったと考えられる。最後の 領域Ⅳでは,破断に伴う除荷によって転位密度が急激 に減少した。これは,転位が対消滅した,もしくは,微 細粒材では粒界密度が非常に高いため、粒界をシンク として消滅したためではないかと考えられる。除荷に よって大きく転位密度が減少するということは,除荷 後に電子顕微鏡等で観察した転位密度や転位組織は, 微細粒材においては変形中の転位密度とは大きく異な

ることを示唆しており,このことがこれまで微細粒材 の特異な機械的性質の正確な理解を妨げていた大きな 要因の一つであると考えられる。

Fig. 11 (a)(b)にCR773L材における引張変形中の公称 応力と転位密度変化を示す。揺動を行うことによって、 粒径20 μ mの粗大粒材においても変形中の転位密度 In-situ測定が可能となり、微細粒材であるARB材と同 様に、粗大粒材においても転位密度は四つの領域を経 て変化することが明らかとなった。しかしながら、転 位増殖開始応力は $\sigma_1=22$ MPaと非常に低く、領域 I は



Fig. 10 Change in stress and dislocation density by stroke change in ARB sample.



Fig. 11 (a) Change in stress and dislocation density by stroke change in CR773L sample, (b) Enlarged view in the low stroke area of Fig. 11(a).



Fig. 12 Change in ρ_{II} with grain size.

非常に短かった。結晶粒径が大きいと結晶粒内におい て活動できるFrank-Read源の最大長さが長くなり, 転 位源が活性化するための応力はFrank-Read源の長さに 反比例するため¹⁰⁾, 粗大粒材では転位増殖に要する最低 応力が低いためであると考えられる。

また,転位が急激に増殖する領域 II も領域 I と同様 に非常に短かった。領域 II から III に移行する時の転位 密度と応力はそれぞれ ρ_{II} =1.57×10¹⁴m⁻², σ_{II} =33 MPa であり, ρ_{II} はARB材におけるそれよりも一桁程度小 さく,ARB材とは異なり,CR773L材においては σ_{II} と σ_{II} には大きな差がなく,ARB材よりも非常に小さかっ た。このため、従来、領域 II の存在をあまり考慮されて いなかったと考えられる。0.2%耐力は34 MPaであり, ほぼ σ_{II} と同じであり、微細粒材ほど σ_{II} との大きな差 はないため、粗大粒材では0.2%耐力を転位増殖開始応 力として扱っても大きな問題は生じないと考えられる。

領域Ⅲでは転位密度がストロークの増加に伴い単調 に増加し,破断直前には初期転位密度の4倍程度の6× 10¹⁴m⁻²に達した。領域Ⅳでは破断に伴う除荷によって 転位密度は減少したが,減少量は領域Ⅲにおいて増加 した転位量の半分程度であった。減少量としては少な くはないが,ARB材などの微細粒材と比較して小さい ため,粗大粒材においては除荷後の試料の転位組織は 変形中との差は大きくないと考えられる。

Fig. 12に1200合金における ρ_{II} の結晶粒径変化を示 す。併せてナノ結晶Niにおける ρ_{II} の結晶粒径依存性 も示す¹³⁾。この ρ_{II} は $d>3\mu m$ では $10^{14}m^{-2}$ 程度でほ ぼ一定であるが, $d<3\mu m$ では粒径の-1乗に比例して 増加した。これは粒径が転位の平均自由行程長さxに



Fig. 13 Relationship between σ_{II} and ρ_{II} in 1200 alloy with various grain size.

及ぼす影響を考えると理解することが出来る。塑性変 形によって生じるせん断ひずみ y は

$$\gamma = \rho b x \tag{1}$$

で表される¹¹⁾。ここで ρ は転位密度, b はバーガースベ クトル, xは転位の平均自由工程である。転位の平均自 由行程長さはせいぜい粒径程度までであるため, 粒径 が小さくなるほど減少すると考えられる12)。そのため、 xが粒径dに比例すると仮定すると,同じ塑性せん断ひ ずみを生み出すためには転位密度は粒径の-1乗に比 例して増加する必要がある。そして,ある一定速度で 塑性変形が進行するために必要な転位密度 p I は粒径が 微細になるほど粒径の-1乗に比例して増加したと考 えられる。よって、転位が増殖しはじめてから、塑性変 形のために必要な転位密度ριに達するまでは転位は急 速に増殖する必要があり,足りない変形量は弾性変形 で補われるために応力は領域Iほどではないものの大 きく増加する。これが領域Ⅱである。そして ρ IIに達す ると以後はほぼ塑性変形のみで変形が進行できるため、 転位の増殖は緩やかとなり. それに伴い応力増加も緩 やかになる領域Ⅲに移行すると考えらえる。以上のこ とから、 ρ_{II} を示す時の応力 σ_{II} も転位増殖開始応力 σ_{II} とは意味が異なる降伏応力としてとらえることができ る。また、粗大粒領域においてριは結晶粒径の-1乗 に比例して増加せず, 粒径の増加によりわずかに減少 する。転位の自由行程長さが粒径の大きさに比例して 無限に大きくなるわけではなく、 粗大粒材では大きく 変化しないためであると考えられる。

Fig. 13に ρ_{II} と σ_{II} の関係を示す。 σ_{II} は ρ_{II} の1/2乗 に概ね比例し, Bailey-Hirschの関係に従っており, 塑性 変形によって変形が進行する領域では,転位の流動応 力は他の転位密度によって決定されている,つまり,運 動する転位の抵抗となるものは他の転位であることを 示している。

4. まとめ

放射光施設SPring-8において,引張試験機ごと揺動 しながらIn-situ XRD測定をすることによって,粒径 20 μ mの粗大粒材料においても引張変形中の転位密度 変化を測定することが可能となった。その結果,転位 密度は微細粒材料と同様に,四つの領域を経て変化す ることが明らかとなり,三つのパラメータ σ_{I} , σ_{I} , ρ_{I} を得ることが出来た。 σ_{I} は転位が増殖を開始する 応力, ρ_{I} は塑性変形のみで変形が進行するために必要 な転位密度, σ_{I} はその転位密度に達した時の応力であ り, σ_{I} と σ_{I} はそれぞれ物理的意味が異なる降伏応力 とみなせる。

微細粒材料は, 従来工業的に用いられてきた粗大粒 材料よりも微細粒材料は塑性変形に必要な転位密度 ρ_{II} が非常に大きい材料であると言える。そのため, その 転位密度が ρ_{II} に達するまで急激に増加する領域IIは広 い。一方, 粗大粒材では ρ_{II} が小さいため領域IIは狭く, 弾性変形領域(領域I)からすぐに塑性変形領域(領域 II)に移行するため, 領域IIを考慮する必要が小さかっ たが, 微細粒材では領域IIを考慮して, その機械的性質 を理解する必要があると考えられる。

謝 辞

本研究の一部は(公社) 軽金属奨学会統合的先端研究 "超微細粒アルミニウムが示す特異な力学特性の発現機 構の統一的解明"の助成により行われました。また,放 射光測定はSPring-8 BL19B2にて一般課題(産業利用分 野)2014B1580,2017A1817,2018B1588にて行われまし た。

参考文献

- N. Kamikawa, X. Huang, N. Tsuji, N. Hansen: Acta Mater., 57 (2009), 4198-4208.
- 2) X. Huang, N. Hansen, N. Tsuji: Science, **312** (2006), 249-251.
- H. Adachi, Y. Miyajima, M. Sato, N. Tsuji: Mater. Trans., 56 (2015), 671-678.
- H. Adachi, Y. Karamatsu, S. Nakayama, T. Miyazawa, M. Sato, T. Yamasaki: Mater. Trans., 57 (2016), 1447-1453.
- Y. Miyajima, S. Okubo, T. Miyazawa, H. Adachi, T. Fujii: Philos. Mag. Let., 96 (2016), 294-304.
- S. Nakayama, H. Adachi, T. Nabeshima, T. Miyazawa, T. Yamasaki: Sci. Adv. Mater., 8 (2016), 2082-2088.
- 7)高增宣仁,宮澤知孝,宮嶋陽司,足立大樹,尾中晋:日本金属 学会誌,83 (2019),157-165.
- G. K. Williamson, R. E. Smallman: Philos. Mag., 8 (1956), 34:45.
- G. K. Williamson, R. E. Smallman: Acta Crystallogr., 7 (1954), 574-581.
- 10) T. Ohashi, M. Kawamukai and H. Zbib: Int. J. Plasticity, 23 (2007), 897-914.
- W. G. Johnston, J. J. Gilman: J. Appl. Phys., 30 (1959), 129-144.
- 12) 足立大樹,寺田大将,辻伸泰:軽金属,69 (2019),555-561.



足立 大樹(Hiroki Adachi) 兵庫県立大学 工学研究科



平田 雅裕(Masahiro Hirata) 兵庫県立大学 工学研究科 大学院生



岡井 大祐(Daisuke Okai) 兵庫県立大学 工学研究科



中西 英貴(Hidetaka Nakanishi) (株)UACJ R&D センター 第二開発部